

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС № 2
Группа «Микропроцессорные системы»

Руководитель группы к.т.н.

Некрасов Павел Владимирович pavel@spels.ru, +7-926-279-3

Группа обеспечивает подготовку и проведение испытаний микропроцессоров, микроконтроллеров

При подготовке и проведении испытаний обеспечивается измерение ряда критериальных параметров

В область научных интересов сотрудников группы входит: исследование радиационных эффектов

Иллюстрация направлений работы группы

В ходе испытаний сложно-функциональных СБИС, таких как микропроцессоров, микроконтроллеров

{joomplu:1240}

Иллюстрация подхода к контролю функционирования

При тестировании сложно-функциональных СБИС в ходе радиационного эксперимента нами реализованы

{joomplu:1241}

{joomplu:1242}

Иллюстрация принципов выбора процедур выбора контрольных точек для сложного функционала для СБИС

Методы тестирования в процессе радиационного эксперимента могут быть основаны на применении

{joomplu:1243}

Типовые методы тестирования МК и МП в процессе радиационного эксперимента

Наиболее важным критериальным параметром характеризующим дозовую деградацию, является

{joomplu:1244}

{joomplu:1245}

Методика контроля тока потребления

в процессе проведения исследования функционального прерывания при исследовании

{joomplu:1247}

{joomplu:1246}

Иллюстрация внешнего вида интерфейса ПО

обеспечивающего контроль функционирования

микросхемы 8-битного микроконтроллера

программы в LabView для управления

и контроля микросхемы 8-битного микроконтроллера